

基于步进加速退化试验的电子产
品可靠性评估技术

贾占强,蔡金燕,梁玉英,韩春辉

收稿日期 修回日期 网络版发
布日期 接受日期

摘要 为实现高可靠、长寿命产品的
可靠性评估,提出了步进加速退化
试验的新方法.首先给出了步进加速
退化试验方法及其基本假设,然后探
讨了步进退化数据向恒加退化数据
的折算方法,在此基础上提出了基于
伪失效寿命的步进加速退化可靠性
评估算法和基于随机退化轨迹的步
进加速退化可靠性评估算法,最后利
用试验数据对该方法进行了验证.结
果表明:与恒加退化试验相比,该方
法可以极大地缩短试验时间和减少
试验样本,因此,具有更高的效费比.

关键词 [步进加速退化试验](#) [伪](#)
[失效寿命](#) [随机退化轨迹](#) [可靠性](#)
[评估](#)

分类号

| 扩展功能 | |
|---|--|
| 本文信息 | |
| ▶ Supporting info | |
| ▶ PDF(773KB) | |
| ▶ [HTML全文](0KB) | |
| ▶ 参考文献[PDF] | |
| ▶ 参考文献 | |
| 服务与反馈 | |
| ▶ 把本文推荐给朋友 | |
| ▶ 加入我的书架 | |
| ▶ 加入引用管理器 | |
| ▶ 引用本文 | |
| ▶ Email Alert | |
| 相关信息 | |
| ▶ 本刊中 包含“步进加速退化试验” 的 相关文章 | |
| ▶ 本文作者相关文章 | |
| · 贾占强 | |
| · 蔡金燕 | |
| · 梁玉英 | |
| · 韩春辉 | |